

	•	
Application/Control No.	Applicant(s)/Patent under Reaxamination INOUE, TAKAHIRO	
10/791,825		
Examiner	Art Unit	
Long Nauven	2816	

SEARCHED					
Class	Subclass	Date	Examiner		
327	432-434 108,	5/4/05	3		
	376.377				
326	82-84,89	y	4		
updak	nove	12/12/05	in		
yBolor	e above	4/3/06	w		
upoler	te usoce	7/7/06	W		
·					
·			· ·		
			· .		

INTERFERENCE SEARCHED				
Class	Subclass	Date	Examiner	
PG -	pub Sea	MCL 4/3,	66. CN	
(See	- pain	t out )	-	
1 '~ '	ab scar pent	7.13	6 W	

SEARCH NOTES (INCLUDING SEARCH STRATEGY)				
·	DATE	EXMR		
East	5/4/05	W		
		•		
·	·			
·				
	·			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·			